

受託事業メニュー(エンネット(株)、2017年5月)

No.	測定メニュー	条件	評価内容
コース1 個別セル (モジュール)	充放電特性測定	測定温度:25℃ 充放電レート:0.1C 標準3セル(個別) (または、1モジュール)	充放電曲線 dQ/dE曲線 放電容量
	Option1:レート特性	3.2Aまでレート3点(個別セル時) 5Aまでレート3点(モジュール時)	充放電レート特性
	Option2:インピーダンス (等価回路解析)	SOC=30,50,70% (SOC=50%)	インピーダンス特性 等価回路パラメータ
コース2 個別セル	充放電特性測定	測定温度:25℃ 他2点 最大6セル(個別)	充放電曲線 dQ/dE曲線 放電容量
	基本特性 インピーダンス測定	SOC:100~0%(10%毎)	Nyquist図 Bode図
	等価回路解析	(SOC=50%,温度3点)	等価回路パラメータ
コース3 個別セル	充放電特性測定 インピーダンス測定 劣化促進3点 データベース用測定 インピーダンス測定 等価回路解析	測定温度:5, 15, 25, 35, 45℃ SOC:100~0%(10%毎) SOH:1.00~0.85(4点) 最大6セル 1セル分 (SOC=50%,SOH4点、温度5点)	充放電曲線 dQ/dE曲線 放電容量 Nyquist図 Bode図 等価回路パラメータ
	Option1 データベース化 等価回路解析	インピーダンス測定データ 等価回路パラメータ(6セル全測定)	データベース(Excl)
コース4 個別セル	劣化診断用 充放電特性測定 インピーダンス測定 劣化促進10点 等価回路解析 データベース構築 アルゴリズム化	測定温度:5, 15, 25, 35, 45℃ SOC:100~0%(10%毎) SOH:1.00~0.50(11点) 最大12セル(複数システム使用) 高温および低温劣化促進試験 (劣化セルの提供で期間短縮可)	充放電曲線 dQ/dE曲線 放電容量 Nyquist図 Bode図 等価回路パラメータ データベース アルゴリズム試作

インピーダンス測定 周波数範囲:100kHz~0.01Hz
印加電流:2mA~2A

(モジュール測定では10kHzが上限)
(下限値はshunt抵抗値に依存。上限値は電源出力値に依存。)

